

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

**(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum**  
**Internationales Büro**



**(43) Internationales Veröffentlichungsdatum**  
**26. Mai 2005 (26.05.2005)**

**PCT**

**(10) Internationale Veröffentlichungsnummer**  
**WO 2005/048355 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 31/0232,  
G02B 5/18

**Ralner (AT/AT); Josef-Kraimer-Ring 2, A-8141 Unterpremstätten (AT).**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/011304

(22) Internationales Anmeldedatum: 8. Oktober 2004 (08.10.2004)

(74) **Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).**

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Aufgaben zur Priorität: 103 52 741.9 12. November 2003 (12.11.2003) DB

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AUSTRIAMICROSYSTEMS AG [AT/AT]; Schloss Premstätten, A-8141 Unterpremstätten (AT).**

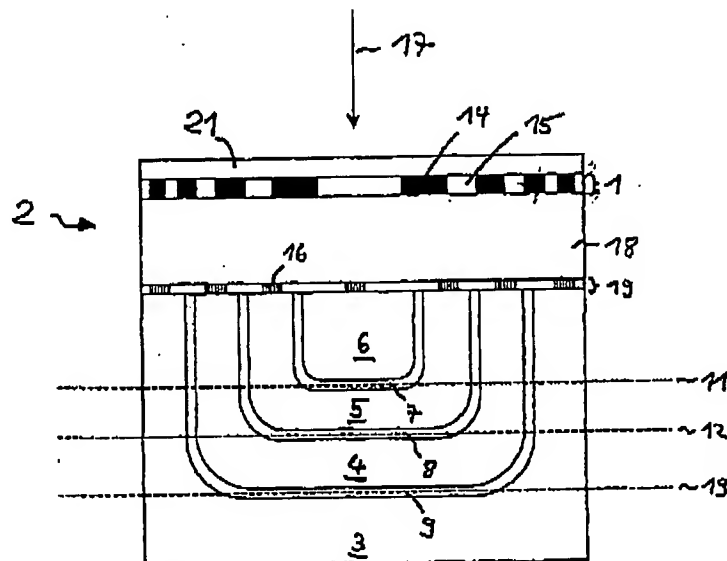
(81.) *Bestimmungsstaaten (sowelt nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart):* AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BE, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, BG, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MINIXHOFER,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT WHICH CAN DETECT RADIATION

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSDETEKTIERENDES OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT



(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component which can detect radiation, comprising a semi-conductor chip (2) provided with one or several areas which are sensitive to radiation (7, 8,9) and which are used to detect electromagnetic radiation (17). The electromagnetic radiation (17) is focused in the areas which are sensitive to radiation (7, 8, 9) by means of a diffraction element (1) which is preferably integrated into the semi-conductor chip. The diffractive element (1) can also more particularly be a zone plate.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

**WO 2005/048355 A1**

**BEST AVAILABLE COPY**